

Системы для измерений на подложке (Wafer-Level Measurement Solutions - WMS)

Keysight Technologies и
Cascade Microtech

Оптимальная конфигурация, установка и сервисная поддержка для обеспечения высокой точности измерений

Точность и воспроизводимость измерений на подложке имеет огромную важность при моделировании приборов, разработке технологий и технологических процессов, определении их технических характеристик, мониторинге технологических процессов, определении технических характеристик компонентов и производстве опытных образцов. Полупроводниковые технологии продолжают развиваться, сроки выхода изделий на рынок сокращаются, поэтому возрастает потребность в повышении точности измерений. Эти задачи требуют создания интегрированного решения, которое позволяет быстро и точно провести тестирование приборов и компонентов при постоянном токе и высокой частоте.

Чтобы сформировать систему, отвечающую этим задачам, вам нужно определить набор необходимых измерительных устройств, зондовых измерительных установок для работы с пластинами, радиочастотных зондов и зондов для работы с постоянным током, а также программного обеспечения от различных поставщиков, приобрести все это оборудование и программы, а затем проверить их совместную работу на месте, еще до того, как можно будет протестировать первый прибор. Могут пройти недели и даже месяцы, прежде чем вы, выполнив измерения, впервые будете уверены в корреляции данных и точности измерений на разных участках.

Компании Keysight Technologies и Cascade Microtech предлагают полностью интегрированные системы для измерений на компонентах и определения характеристик приборов. Зондовые установки для измерения электрических параметров полупроводниковых пластин от компании Cascade Microtech, микроволновые зонды и зонды с подачей постоянного напряжения смещения, а также средства калибровки в сочетании с испытательным оборудованием и программным обеспечением для измерений и анализа от компании Keysight позволяют выполнять обширные программы измерений на всех ваших компонентах.

Эти решения поставляются в различных вариантах исполнения — от полностью интегрированной новой системы с полуавтоматической или ручной зондовой установкой до специализированного инструментального дополнения к имеющимся зондовым установкам. Для определения характеристик приборов к имеющейся системе для измерения электрических параметров полупроводниковых пластин можно также добавить новую программную платформу для измерений WaferPro-XP от компании Keysight.

- Точные и воспроизводимые измерения на подложке
- Предварительная проверка варианта исполнения и системных настроек
- Установка в соответствии с требованиями заказчика
- Единый контакт для оказания поддержки
- Оптимизация системы квалифицированными специалистами
- Оптимальный выбор исполнения и системных настроек, установка и поддержка системы



Системы для измерений на подложке

Интегрированные решения для измерения и определения электрических параметров устройств на пластине от Keysight и Cascade Microtech представляют собой новую модель поставки систем для измерения электрических параметров устройств на пластине: своим заказчикам, работающим в полупроводниковой отрасли, мы гарантируем подбор оптимального исполнения и системных настроек, а также установку и поддержку поставляемого продукта.

Можете быть уверены, что Keysight и Cascade Microtech предоставят вам измерительную систему, исполнение и системные настройки которой наилучшим образом подходят для применения именно на ваших устройствах. Перед поставкой система проходит предварительную проверку. После доставки и установки продукта на месте специалистом компании Cascade Microtech его исполнение и системные настройки проверяются вновь с учетом ранее согласованных требований к приемке. Специалисты Cascade Microtech также проводят обучение пользователей, сокращая срок проведения первого измерения.

К каждой системе для измерения электрических параметров устройств на пластине предлагается пакет полной поддержки со стороны специалистов, которые обладают высокой квалификацией в области тестирования и измерения электрических параметров устройств на пластине и могут ответить на любые вопросы заказчика при возникновении проблем. Квалифицированный системный специалист будет работать с вами над оптимизацией системы в соответствии с вашими текущими требованиями к измерениям, определению характеристик и моделированию. Чтобы проблемы решались быстрее, по всем вопросам можно обращаться в компанию Cascade Microtech, которая станет для вас единым контактом для оказания поддержки.

Благодаря тому, что мы гарантируем подбор оптимального исполнения и системных настроек, а также установку и поддержку продукта, ваша система для измерения электрических параметров устройств на пластине от Cascade Microtech и Keysight позволит быстро, точно и качественно выполнять измерения с помощью зонда, сводя к минимуму время до первого измерения и обеспечивая корреляцию между участками.

Компоненты системы

Keysight Technologies

N5222x/4x	Анализатор цепей PNA/PNA-X
B1500A	Анализатор полупроводниковых приборов
N6705B	Модульный анализатор питания постоянного тока
WaferPro-XP	Программная платформа для измерений
IC CAP	Платформа для моделирования

Cascade Microtech

Summit 12000	Зондовая установка для 200 мм пластин
Elite 300	Зондовая установка для 300 мм пластин
WinCal XE	Программное обеспечение для калибровки
Infinity Probes	Зонды для пластин на 500 ГГц
ISS	Нормативы калибровки стандартных подложек по полному сопротивлению

Чтобы узнать, как данное техническое решение поможет решить Ваши конкретные задачи, пожалуйста, свяжитесь с компанией Cascade Microtech, партнером по техническим решениям компании Keysight

www.keysight.com/find/cascade



Работая совместно, компания Keysight и ее партнеры по разработке системных решений в индивидуальном порядке помогают заказчикам справляться с их задачами на уровне проектирования, производства, установки и поддержки продукта. Дополнительные сведения о программе, наших партнерах и решениях: www.keysight.com/find/solutionspartner

Компания Cascade Microtech является мировым лидером в области точных контактных измерений электрических параметров и тестирования интегральных схем (ИС), оптических приборов и других малогабаритных систем. www.cascademicrotech.com

О продукции, системах и услугах компании Keysight Technologies: www.keysight.com

© Keysight Technologies, 2014
Published in USA, August 4, 2014
5991-4631RURU